**Протокол измерения вольт-амперных характеристик**

**Образец:** NAME

**Дата:**

**Провел:**

**Оборудование:**

1. источник-измеритель Keithley 2636B;
2. лазер 980 нм 8 мВт/см2;
3. осциллограф Hantek 4254C;
4. обтюратор Thorlabs MC2000B-EC;
5. зондовая станция.

**Методика:**

Исследуемый образец помещался в специальный держатель, который обеспечивал его позиционирование и электрический контакт электродов с образцом. Для измерений использовался канал №1 источника-измерителя, а также каналы №1 и №2 осциллографа. Измерения проводились в отсутствие и при наличии засветки.

Мощность падающего света – value Вт/см2

Схема подложки показана на рисунке 1:

Рисунок 1 – Схема подложки

Таблица 1. Характеристики образца

| **Пиксель** | **Сторона пикселя, мкм** | ***R*дифф, МОм** | ***R*дифф×*S*, Ом·см2** | ***D*\*, Джонс** | ***U*xx, В** | ***I*кз, А** | ***j*кз, А/см2** | ***S*0, А/Вт** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

**Выводы:**